

① **2.990.544** – ⑫ (A1) – ⑳ [12 01371]. – ㉔ **11 mai 2012.** – ⑤① **G 06 Q 40/00 (2013.01).** – ⑤④ **DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE GESTION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE** – ⑦② (Inventeur: CLOCHEAU JEAN FRANCOIS). – ⑦① *Demandeur: CLOCHEAU JEAN FRANCOIS,* – ⑦④ Mandataire: CLOCHEAU JEAN FRANCOIS

toute fraude possible préjudiciable aux rentrées fiscales. L'invention trouve son application dans tous les états qui appliquent la TVA.

⑤⑦ Dispositif technique caractérisé par une automatisation complète de la gestion, allant de la déclaration de la part des assujettis, au traitement par les banques et, à la perception par les états bénéficiaires, de la Taxe à la Valeur Ajoutée, appelée aussi TVA.

L'invention concerne un dispositif permettant de déclarer, pour un assujetti à la TVA, la création d'une facture d'achat ou de vente et de la transférer automatiquement sous forme de fichier informatique vers le centre de gestion de la TVA dont il dépend. Lors du paiement de la facture, la banque du vendeur ou de l'acheteur, suivant la situation, transmet au centre de gestion de la TVA les identifiants de ce règlement. Celui-ci compare la déclaration de l'achat avec celle de vente puis, délivre à la banque du paiement, en cas d'égalité, une autorisation fiscale d'extraction. Les banques appliquent les directives des autorisations fiscales d'extraction jointes aux navettes durant les circuits bancaires, conduisant à la perception par les états bénéficiaires de la TVA et, à la régularisation des comptes des assujettis.

L'invention à pour but principal, d'une part; d'automatiser en simplifiant à sa plus simple expression, la gestion de cet impôt au sein des assujettis à la TVA, en leur offrant des gains de productivité immédiats liés à cette simplification et, d'autre part de faciliter la gestion administrative de cet impôt par les états bénéficiaires, en supprimant

---

① **2.990.545** – ⑫ (A1) – ⑳ [13 54175]. – ㉔ **07 mai 2013.** – ⑤① **G 06 T 7/60 (2013.01), G 06 T 7/40, G 01 B 11/00.** – ⑤④ **SYSTEMES ET PROCEDES POUR LA DETECTION, LA CLASSIFICATION ET LA QUANTIFICATION DE CARACTERISTIQUES DE SURFACE DE PLAQUETTE AVEC DES OUTILS DE METROLOGIE DE GEOMETRIE DE PLAQUETTE.** – ⑦② (Inventeurs: CHEN HAIGUANG; SINHA JAYDEEP; KAMENSKY SERGEY). – ⑦① *Demandeur: KLA-TENCOR CORPORATION Société anonyme,* – ⑦④ Mandataire: CABINET NETTER. – ③① **Priorité: US, 11 mai 2012, n° 13469339.**

⑤⑦ La présente invention concerne des systèmes et des procédés qui fournissent des capacités d'inspection des microdéfauts à des systèmes optiques tels que des outils de métrologie et des systèmes interférométriques pour plaquettes. Les systèmes et procédés selon la présente invention permettent de détecter, de classer et de quantifier des caractéristiques de surface d'une plaquette, les défauts détectés étant classés et des informations importantes de métrologie des défauts que sont la hauteur/profondeur, l'aire et le volume étant consignées. Les systèmes et les procédés selon la présente invention fournissent par conséquent un plus grand nombre de valeurs qui permettent de quantifier l'effet négatif de ces défauts sur la qualité des plaquettes.